

SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE MATERIALES

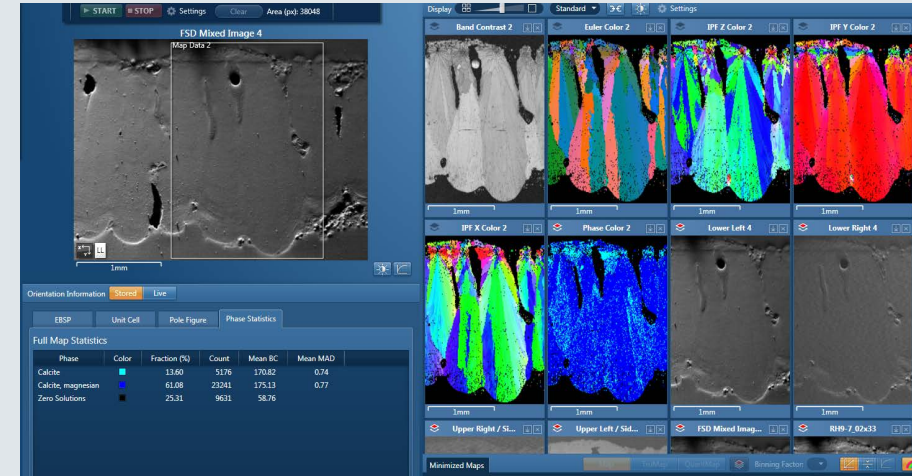
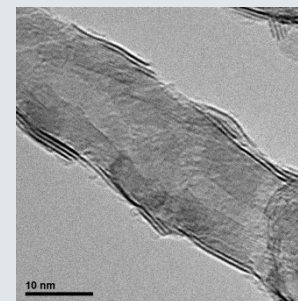
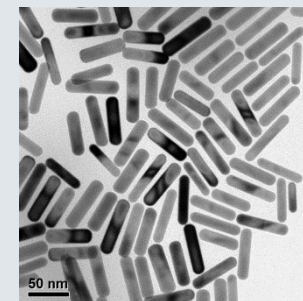
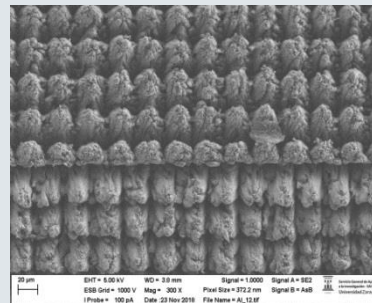
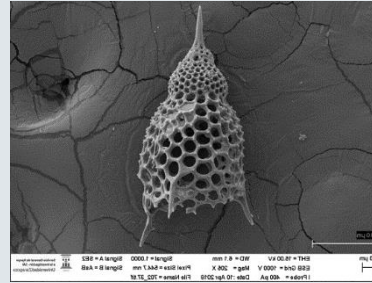


Servicio General de Apoyo
a la Investigación - SAI
Universidad Zaragoza

PRESTACIONES

que se realizan:

- ✓ Información y asesoramiento en la preparación y observación de muestras para microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión.
- ✓ Preparación de muestras de materiales para SEM, tanto en polvo como masivas:
 - Embutición y pulido estándar.
 - Pulido para observación EBSD.
- ✓ Preparación de muestras de materiales para TEM, en polvo y masivas:
 - Adelgazamiento iónico.
 - Corte con ultramicrotomo.
- ✓ Recubrimiento de Pt, Au o C de muestras no conductoras.
- ✓ Observación de muestras mediante microscopía electrónica de barrido:
 - Con cañón de emisión de electrones por emisión de campo (FESEM), que permite observaciones de hasta 0.8nm de resolución espacial.
 - Detectores "in-lens", tanto de electrones secundarios como de retrodispersados.
 - Detector EDS para análisis, por dispersión de energías de rayos X.
 - Detector EBSD para registro y análisis de diagramas de difracción de electrones retrodispersados y mapas de orientación cristalográfica.
 - Detector STEM.
 - Detector de cátodo-luminiscencia.
- ✓ Observación de muestras mediante microscopía electrónica de transmisión.



Contacto:

<http://sai.unizar.es/microscopia-electronica-de-materiales/>

microsel@unizar.es

COLABORACIONES

con otros Servicios de la Universidad:

- ✓ Acuerdo con el LMA (Laboratorio de Microscopías Avanzadas): esta colaboración se concreta actualmente en la utilización de los microscopios electrónicos de transmisión de uso general, FEI T20 y FEI F30.
 - El FEI T20 es un TEM con fuente de emisión termoiónica.
 - El FEI F30, con cañón de emisión de campo, está equipado con detector EDS y con otras características como STEM-HAADF, EELS y tomografía.